

SEBI[®]RT 1000

新型波前传感器



SEBI® RT1000

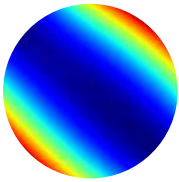
SEBI RT1000是由Wooptix公司开发的波前传感器。该设备采用Wooptix独有的波前相位成像（WFPI）技术，采集两幅离焦强度图像，并获取被测样品的波前相位图；这些图像通过电调谐透镜（ETL）获取。

SEBI RT1000为用户提供了极高的波前相位空间采样分辨率（1000 × 1000像素）、实时处理能力（30帧/秒）以及绝对波前精度（ $< \lambda/30$ RMS），可完美应对最具挑战性的测量任务。

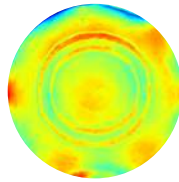
SEBI RT1000通过纳米范围内的相位数据采集，帮用户能够灵活的对透明或反射样品进行表征。



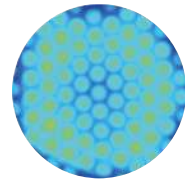
典型应用



光学特性



材料检验



质量控制

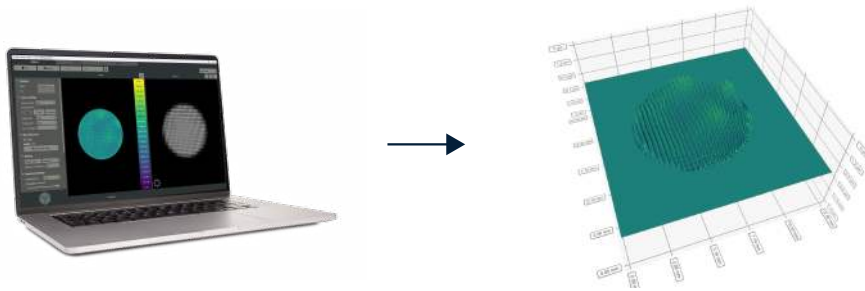
技术参数

相位采样	1000 x 1000
横向分辨率	12.5 μm
可重复性	$\sim \lambda/30$ RMS
孔径尺寸	15x15 mm
波前精度	$< \lambda/30$ RMS
波长范围	380-650 nm
实时处理	30 fps
接口类型	USB 3.0
操作系统	Windows

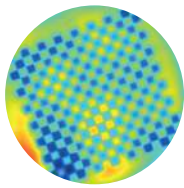


SEBI[®] Analyzer Suite分析软件套件

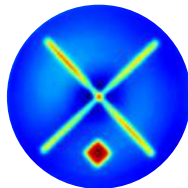
SEBI RT1000 配备了专用软件—— SEBI 分析软件套件，可帮助用户采集数据。实时获取全分辨率下的相位图与强度分布；该方法可提供光程差数据。对测试样品进行（OPD）分析，并提供详细结果。SEBI Analyzer Suite可帮助用户实现根据需要对获取的信息进行处理（例如：过滤泽尼克系数）。



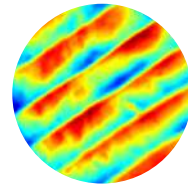
测试案例



带图案
石英窗口片



校准目标



菲涅尔
透镜

产品优势

- 高分辨率,实时相位成像
- 易于安装,操作简单
- 适用于多种样品种类

SEBI[®] RT1000 主要功能

SEBI RT1000波前传感器可轻松集成至任何实验装置或设备中（即插即用），用于采集并处理被测样品的高分辨率波前相位图。

- **波前传感器:** 1000 x 1000 像素传感器，工作范围覆盖可见光波段。
- **文档:** 软件,安装手册和使用说明，旨在为用户提供关于如何使用SEBI RT1000的详细信息。
- **SEBI Analyzer suite分析软件套件:** 用于获取相位图并实时处理数据的软件。



WOOPTIX

公司总部

Tenerife

Nanotec Building
Calle Rectora María Luisa Tejedor Salguero
Las Mantecas Urban Park, 38320
San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, Spain
info@wooptix.com +34 822 900 502
www.wooptix.com

中国地区



北京量感科技有限公司
info@q-opto.com
010-5365 5786
13522713167 (微信同号)
www.q-opto.com

办公室

Madrid

Ronda de Poniente 8, Planta 1
Tres Cantos, Madrid. Spain

San Francisco

Palo Alto, CA 94301
United States

Grenoble

MINATEC Enterprises, BHT2
France



Wooptix是一家半导体晶圆计量领域的创新企业，能提供快速、精确且具有极高横向分辨率的在线测量方案。凭借其采用源自自适应光学研究的专有技术——波前相位成像（WFPI），该公司的系统可在单次测量中全面测定硅晶圆的整体形状、纳米形貌及表面粗糙度。该公司已积极在亚洲、欧洲和北美地区的多个客户现场推广其解决方案。

结合其优异的抗振动性能及易于适应用户需求的特点，这些系统成为单次测量即可完成晶圆形状与纳米形貌分析的理想选择。